

# 防振系方針 (私案)

- TAMAなどを使用して、Type-Bのプロトタイプ試験+ First article testを行う。構成を省略したのではなく、ほぼそのままLCGTサイトに移転できる形での試験が望ましい。
- iLCGTの段階で、テストマスに加え、bLCGTでType-Bになる箇所は極力Type-Bを使用する。上記試験で開発されたものを変更なくインストールしていき、この時点での新規開発項目はゼロにしておくべき。
- 現状は2014年9月にiLCGT完了となっているが、上記の具体的な開発計画を示した上で、iLCGTの期間を半年延長する。ただし、2014年9月の「初期観測」は、実施できるようにする。(iLCGTの途中で少し観測運転もする、ということにし、対外的な約束を満たす。)
- Type-Aの開発は、iLCGT完了後、もしくは並行して、上フロアを中心に現地で進める。物理的な干渉がありそうなら、iLCGTで入れるType-B防振系とテストマスの位置は多少ずれていても構わない(arm長が少し変わっても構わない)。光学設計が少しずれるだろうが、問題になるレベルでは無いと思われる。
- bLCGT以降時には、テストマス用に使用していたType-B防振系と真空槽は別の箇所に流用する。それを見越して、本来Type-Bを使用すべき箇所のうち4箇所はiLCGTの間はType-Cなり、防振無しなりにしておいても良い。最初にテストマス用Type-Bを位置をずらして置いておいた場合、ある程度そのままにしておいて、常温干渉計のセットアップも維持しておくのも一案。